

OCI-T 光学器件分析系统

产品特点 >>>

- 空间分辨率：20 μ m
- 测量长度：20m
- 中心波长：1550nm
- 插损、回损分析

产品应用 >>>

- 无源器件插损、回损测量
- 硅光芯片插损、回损测量
- 平面波导器件测试
- 光学链路分析、诊断

产品描述 >>>

OCI-T光学器件分析系统具有功能齐全、性价比高等特点，可实现从器件到光学链路全范围的精确插损、回损、长度测量，长度测量范围为10m，精度可达毫米量级，空间分辨率为20 μ m。非常适用于定量分析、品质监测及故障诊断。

产品参数 >>>

型号	OCI-T	单位
测量长度 ¹	20	m
空间分辨率 ²	20	μ m
波长扫描范围	40	nm
中心波长	1550	nm
波长精度	1.0	pm
回损动态范围	65	dB
回损测量范围	-130~0	dB
回损灵敏度	-130	dB
回损测量精度	± 0.5	dB
插损动态范围 ³	13	dB
插损测量精度	± 0.5	dB
输入电压	AC 220/110V; DC 12V	-
主机功率	60	W
通讯接口	USB	-
光纤接口	FC/APC	-
尺寸	D 330 * W 350 * H 160	mm
重量	7.5	kg
储藏温度	0~50	$^{\circ}$ C
工作温度	10~40	$^{\circ}$ C
工作湿度	10~90	%RH

备注：

1. OCI-T测量长度为20m，后续支持升级至100m。
2. 空间分辨率为20 μ m，后续支持升级至10 μ m。
3. 插损动态范围是指标准单模光纤其散射水平被本底噪声淹没之前的最大单向损耗。



武汉东隆科技有限公司

电话：027-87807177 邮箱：sales@etsc-tech.com 网址：www.etsc-tech.com
地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)
产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

